極超音速統合制御実験(HIMICO)用インテークにおけるサイドクリアランスの影響

Influence of the side clearance on the inlet for Hi-Mach Integrated Control Experiment (HIMICO)

O佐野 正和^{*1}, 吉田 秀和^{*2}, 長尾 志^{*2}, 佐藤 哲也^{*1}, 橋本 敦^{*3}, 小島 孝之^{*3} ※1 早稲田大学基幹理工学部、※2 早稲田大学基幹理工学研究科、※3 宇宙航空研究開発機構

記号

M∞		主流マッハ数	
P_t	kPa	全圧	
$P_{t\infty}$	kPa	主流全圧	
MCR		流量捕獲率	
TPR		全圧回復率	
h∞	mm	インテーク入り口高さ	17.8 mm
h_{th}	mm	インテークスロート高さ	
h _{noz}	mm	ノズルスロート高さ	
W	mm	インテーク入り口幅	43 mm
Wside	mm	サイドクリアランス幅	

1.はじめに

現在、宇宙航空研究開発機構(以下 JAXA)では極超音速空 気吸い込み式エンジンの開発,およびこれを搭載する極超音速 機の研究開発が進められている.この極超音速機が実現するこ とで、太平洋を2時間で横断できるようになるほか、スペース プレーンとして宇宙輸送に展開することも可能となる.開発計 画は大きく3つの段階に分かれており、本研究では第一段階で ある極超音速統合制御実験(High Mach Integrated Control Everyiment: HIMICOULを対象としている(図1) このHIMICO Experiment: HIMICO)(1)を対象としている(図1). このHIMICO実験の目的は機体・エンジンの相互干渉を含む統合制御技術の確立である. これまで,風洞実験,燃焼実験を通して,それぞれの性能取得が進められてきた.



図1 極超音速旅客機開発計画

HIMICO 用エンジン(図 2)は混合圧縮型の矩形インテークを 採用しており、一つの垂直衝撃波と複数の斜め衝撃波を通して 空気の圧縮、減速を行っている.また、本エンジンのインテー クは可変ランプ機構を有しており、スロート高さ h_{th} を調節で きるようになっている.これにより第2ランプで衝撃波の転向 角を変え、流入マッハ数に応じてインテーク性能を調節するこ とが出来る. 同様にノズル部も可変機構を有しており,ノズル高 さ h_{noz} を調節することにより背圧を調節することができる(図 インテーク入り口幅は W=43 mm である. 3).



HIMICO 用エンジン 図 2



図3 可変矩形インテーク,ノズル

2.性能取得と課題

前述の通りこれまで,HIMICO 用エンジンを対象とした風洞 実験⁽²⁾が進められてきた.実験から得られた流量捕獲率(Mass Capture Ratio: *MCR*)および全圧回復率(Total Pressure Recovery: Capture Ratio: MCR)および至上回復率 Iotal Pressure Recovery: TPR)が理論値・解析値に対して大きく下回っていることが問 題となっていた。先行研究^{(3),(4)}からこの原因が,側壁と可変ラ ンプの間にある1mmの隙間にあることがわかった。この隙間 をサイドクリアランスと呼び、この幅を W_{side} と表す。サイド クリアランスは飛行試験において熱膨脹が生じたときに、第 2,3ランプが側壁に干渉しないように設けられている.図4はサイドクリアランスの位置を示している.右側の図が軸方向の幅方向中心断面(センターライン)であり、実線における A-A断面を矢印の方向から見たものが左側の図である.



3.研究目的

本研究では、このサイドクリアランスがインテーク性能へお よぼす影響を数値解析により定量的に評価すること、適切な サイドクリアランス幅 Wside を調査することを目的とする.

4.数值解析条件

数値解析は JAXA の所有するスーパーコンピュータ 「JSS2」で実行し,解析ソルバには JAXA で開発された高速 非構造格子流体解析ソルバ「FaSTAR(Fast Aerodynamic 」 Routines)⁽⁵⁾」を用いている.詳しい解析条件を表1に記す.

表1 解析条件				
次元	3 次元計算			
乱流モデル	SST-2003			
流束評価	SLAU			
空間精度	2 次精度(MUSCL法)			
時間積分	LU-SGS			

また主流条件は風洞実験に合わせて以下のようにした(表 2). まっ ナンゴタル

衣 2 主佩朱忤						
主流マッハ数 M∞		3.4				
主流全温 Tt∞	K	300				
主流全圧 Pt∞	kPa	610				

計算はノズル高さ h_{noz}とサイドクリアランス幅 W_{side}を変化 させて行った.サイドクリアランス幅は実機と同じ1 mm から 0mm(サイドクリアランスなし)まで 0.25mm 刻みで比較し

性能は流量捕獲率 MCR,全圧回復率 TPR の二つの指標を用い て評価した. それぞれの値の定義式は式(1),式(2)であ る.

$$TPR = \frac{4\nu \overline{\nu} - \rho \pm \alpha \pm P_t}{\pm \overline{k} \pm \varepsilon P_{t\infty}}$$
(2)

5.解析結果と考察

図5に性能曲線を示す. 横軸に MCR, 縦軸に TPR を示す. Wside=1 mm のとき,実験値に5%未満の誤差で一致しており, Wside=0 mm のとき,理論値に2%未満の誤差で一致している. ここで理論値とは2次元の衝撃波角度から算出された値であ る.この結果から実験値と理論値の違いの原因がサイドクリ アランスにあることが本研究でも確認された.また性能マッ プからサイドクリアランスの幅を狭めることで性能が上昇す ることが確認できる.性能への影響の仕方に注目してみる と、ノズル高さが高いときと,低いときで影響の仕方が異な ることが分かる. hnoz=9 mm のとき(低流量域)では Wsideの減 少に対しどの範囲でも MCR が増加している. hnoz=13 mm のと き(高流量域)では Wside=0.75 mm から0 mm の範囲で, Wside=1 mm から 0.75 mm での影響に比べ MCR の増加分が少な い.また本研究の解析範囲では Wside=0.25 mm 以下において低 流量域でも大幅なインテーク性能の改善が見込めることがわ かった.



まず高流量域として h_{noz} =13 mm について考察する. 図 6 に h_{noz} =13 mm のときのセンターラインにおけるマッハ数分布を 示す. なお本研究に用いるマッハ数コンターは全て図 6 中に 示すものである. これを見ると W_{side} =1 mm のときのみに第二 ランプ面上に剥離が生じ,流れが大きく転向していることが 分かる.



図 6 センターライン断面におけるマッハ数分布(hnoz=13 mm)

センターラインから側壁方向に 16.5 mm (壁面から 5 mm) 平 行移動した断面におけるマッハ数分布を図 7 に示す. *Wside*=1 mm のときを見ると,第2 ランプ上の剥離が先述の剥離よりも 上流に位置している.これにより斜め衝撃波が下部カウルよ り上流に位置し,インテーク流路外に漏れ出していることが 分かる.この漏れ出しがインテーク捕獲流量の低下の原因で あると考えられる.*Wside*=0.75 mm, 0.5 mm のときを見ると *Wside*=1 mm のときより第2 ランプ上の剥離が小規模である.



図7 側壁付近のマッハ数分布(hnoz=13 mm)

剥離により衝撃波が転向し漏れ出し量が変化していることを 確かめるために,流路に垂直で下部カウル先端を含む断面で のマッハ数分布を図8に示す(断面位置は図8上部に併記). これを見るとWside=1mmのときには第2ランプ中央付近で大 規模な剥離が発生しており,側壁付近でもサイドクリアラン スからの漏れ出しによる剥離が発生しているのに対し, Wside=0.75mm,0.5mmのときには第2ランプ中央付近では剥 離が発生しておらず,側壁付近のサイドクリアランスによる 剥離も規模が小さいことが分かる.これがhno:=13mmのとき におけるWside=1mmと0.75mmの間の性能の大きな違いの原 因であると考えられる.またサイドクリアランスを介してプ レナム室から主流側に空気が漏れ出していることもわかる.



図8 流路垂直方向断面のマッハ数分布(hnoz=13 mm)

次に低流量域の例として h_{noz} =9 mm について考察する. 図 9 に h_{noz} =9 mm のときのセンターラインにおけるマッハ数分布を示す. W_{side} =1 mm のとき,図 6 と比較すると h_{noz} =13 mm のときよりも剥離による斜め衝撃波の転向角度が大きくなっており,第2 ランプから生じる衝撃波が流路外部に漏れ出ていることが分かる. W_{side} =0.75 mm, 0.5 mm のときでは h_{noz} =13 mm では見えなかった剥離が発生し,流れの転向が生じている.



図9 センターライン断面におけるマッハ数分布(hnoz=9 mm)

先ほどと同様に側壁方向に平行移動した側壁付近でのマッハ 数分布を図 10 に示す.図7の h_{noz} =13 mmのときと比べると, W_{side} =1 mmのときでは、剥離による斜め衝撃波が上流側に移動 しており, h_{noz} =13 mmのときよりも大きく空気が漏れ出ている. W_{side} =0.75 mmから 0.5 mmでは h_{noz} =13 mmのときより剥離の規 模が大きくなっており、流れの転向による空気の漏れ出しが発 生している.



図 10 側壁付近のマッハ数分布(hnoz=9 mm)

図 11 に図 8 と同様の断面におけるマッハ数分布を示す. h_{noz} =13 mmのときでは W_{side} =1 mmのときにのみ見られた第 2 ランプ中心での剥離が、 h_{noz} =9 mmでは W_{side} =1 mmから 0.5 mmで見られており、衝撃波が流路外に漏れ出ていることが分 かる.この漏れ出しの量は W_{side} が大きいほどに大きくなって おり、これが流量低下の原因であると考えられる.



図11 流路垂直方向断面のマッハ数分布(hnoz=9 mm)

以上のことから, 流量低下が以下のようなメカニズムで生じ ていると考えた.

- (1) サイドクリアランスから漏れ出す空気により側面付近に おいて剥離が発生する.
- サイドクリアランス幅が大きくなることにより、剥離の 規模が大きくなり、第2ランプ中央付近にも大規模な剥 (2)離が発生する。
- 離か発生する。 (1),(2)の剥離により流れの転向,斜め衝撃波が発生し,外 (3) 部に漏れ出しが生じる.

(1)と(2)では剥離の規模が大きく異なっている. 高流領域では $W_{side}=1 \text{ mm}$ でのみ(2)が発生するが,低流量域では $W_{side}=1 \text{ mm}$ から $W_{side}=0.25 \text{ mm}$ まで(2)が発生する. これが高流量域と低流 量域でのサイドクリアランスの影響の違いの原因だと考えら れる.

6.結論

- 本研究からわかったことを以下に列挙する. i. サイドクリアランスにより流路上に剥離が発生し,これに よる斜め衝撃波が流路外に漏れ出ることで流量が減少す ろ
- a.
 b.
 b.
 b.
 c.
 b.
 c.
 c.
- とで性能向上が見込まれる.特に 0.25 mm以下にすることで理論値に近い性能を得ることができる.

7.参考文献

- (1). 佐藤他, "観測ロケットを利用した極超音速統合実験 (HIMICO) その1~実験概要", 平成 25 年度宇宙輸送シ ンポジウム STCP-2013-023 (2013)
 (2). 天野他, "ロケットを利用した極超音速推進・統合制御実 験(HIMICO) におけるインテークの風洞試験", 平成 26 年 度宇宙輸送シンポジウム,2015
 (3). Yoshida, H., et al., "Numerical Study of Hypersonic Air Intake Aerodynamics Performance for High Mach Integrated Control
- Aerodynamics Performance for High Mach Integrated Control Experiment "HIMICO" 53rd AIAA Propulsion and Energy
- Experiment HIMICO 35ft ATAA Propulsion and Energy Forum, AIAA-2017-4652, 2017. 吉田他,"極超音速統合制御実験(HIMICO)用インテークで の剥離とその対策",第 30 回数値流体力学シンポジウ (4). ム,2016
- 橋本他, "高速流体ソルバ FaSTAR の開発", 航空宇宙数値 (5). シミュレーション技術シンポジウム 2010 論文集, pp.79-84